

(参考) あいちシンクロtron光センターの利便性向上に向けた改善活動 (平成25年度)

I 設備機器等の取組

H26. 3末

BL名	既整備分 (25.6~26.3)			
BL5S1 硬X線 XAFS	1	自動試料交換装置(9連)	8	quick XAFS
	2	自動測定プログラムソフト	9	in-situ測定等、支燃性・可燃性ガス供給排気システム
	3	ユーザー用解析PC	10	時間分解(in-situ)XAFSフローセル
	4	ライトル検出器	11	試料位置調整用レーザー(前方入射)
	5	転換電子収量(Heガスシステム)	12	サンプル用デンシケータ
	6	マイクロXAFS(キャピラリー集光:分解能20um)	13	ユーザー用マニュアル
	7	マッピングXAFS	14	サンプル用錠剤成形器(2台)
BL5S2 X線回折	15	高低温吹き付け装置	21	PDXL(総合解析用ソフト)
	16	自動測定プログラムソフト	22	ユーザー用解析PC
	17	自動試料交換装置(キャピラリー専用)	23	ユーザー用マニュアル
	18	板状サンプルアタッチメント	24	XAFS(透過・ライトル検出器) 8~23keV
	19	PILATUS	25	測定代行用搬送ケース
	20	試料位置調整用レーザー(前方入射)		
BL6N1 軟X線 XAFS	26	XPS用サンプルバンク(XAFS・XPS, 真空・大気圧)	30	自動測定プログラムソフト
	27	XPS用トランスファーベッセル(XAFS・XPS, 真空・大気圧)	31	ユーザー用解析PC
	28	XAFS用サンプルホルダー(2台)	32	ユーザー用マニュアル
	29	支燃性・可燃性ガス供給排気システム	33	アルミ縁台
BL7U 真空紫外 分光・光電 子分光	34	自動測定プログラムソフト	38	サンプル用CCDカメラ
	35	解析用ソフト	39	ユーザー用マニュアル
	36	ユーザー用解析PC	40	サンプル用デンシケータ、真空デンシケータ
	37	高低温調装置		
BL8S1 X線 反射率・ 薄膜 表面回折	41	自動測定ソフト(SmartLab)	47	サンプル確認用レーザー
	42	PILATUS	48	サンプルモニタ用CCDカメラシステム(2台)
	43	GlobalFit(反射率解析用ソフト)	49	X線カメラ(Remote RadEye1EV)
	44	PDXL(総合解析用ソフト)	50	サンプル用デンシケータ
	45	ユーザー用解析PC	51	ユーザー用マニュアル
	46	4結晶チャンネルカットモノクロ		
BL8S3 広角・ 小角散乱	52	自動試料交換装置(6連)	58	イメージインテンシファイア付きCCD検出器
	53	自動測定プログラムソフト	59	プラットパネルディテクタ
	54	ユーザー用解析PC	60	NANO-Solver(粒度分布解析用ソフト)
	55	13.9keV調整	61	サンプル用デンシケータ
	56	カメラ長 4m 新規0.3, 0.5m	62	ユーザー用マニュアル
	57	PILATUS		
BL共通	63	グローブボックス	65	ユーザー用ロッカー
	64	シュレッダー(CD用・紙用)		

II 利用制度の改善

BL名	既改善分 (25.6~26.3)			
BL共通	1	硬X線XAFSの需要急増に伴う第3シフト(18:30~22:30)の利用枠設定 (臨時的措置: 25. 10. 16~26. 3. 31)		
	2	測定代行制度の創設 (26. 1. 9~)		
	3	長期利用申込制度の試行 (26. 1. 28~)		